

## 应用几种谱仪测定大量 $^{242}\text{Cm}$ 中的少量 $^{241}\text{Am}$

@乔盛忠 @佟伯庭 @吕峯 @朱荣保 @杨留成 @徐颖璞

收稿日期 修回日期 网络版发布日期:

**摘要** 本文介绍了用Si(Li)谱仪,Ge(Li)谱仪和 $\alpha$ - $\gamma$ 符合谱仪测定大量 $^{242}\text{Cm}$ 中少量 $^{241}\text{Am}$ 杂质的方法。描述了三种方法的特点,并比较了它们的测量灵敏度和准确度。

**关键词**

**分类号**

### 扩展功能

#### 本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [\[PDF全文\]\(342KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

#### ▶ [参考文献](#)

#### 服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

#### 相关信息

- ▶ [本刊中 无 相关文章](#)
- ▶ [本文作者相关文章](#)

### Abstract

### Key words

DOI

通讯作者